

FPDバックプレーン・TFT用_TEG評価装置

最大±60V印加プログラマブル電源

電源ハイサイドをnA分解能電流計測

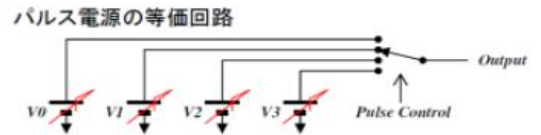
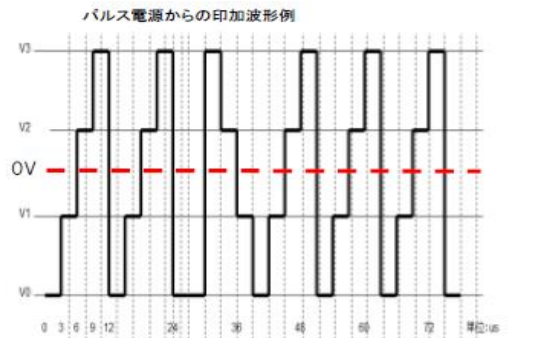
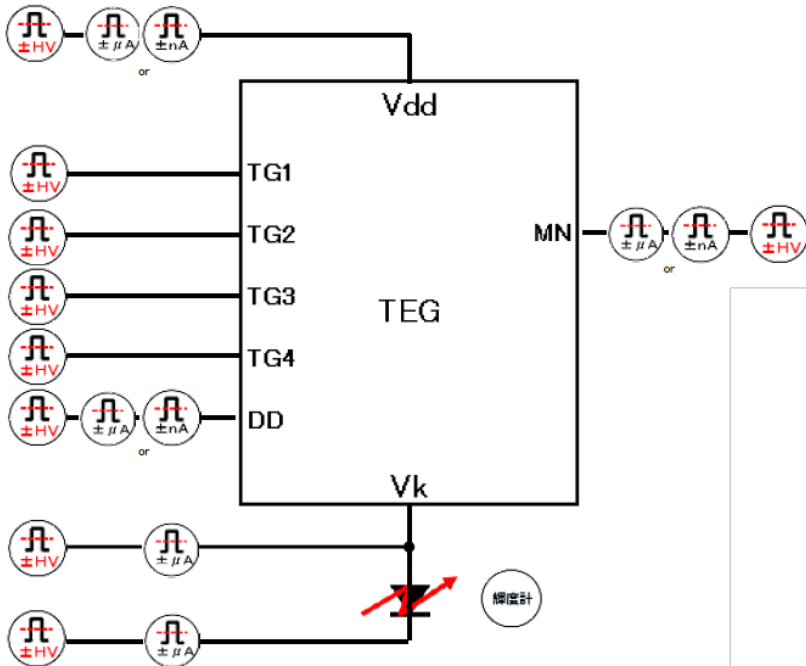
◎ご相談ください。各種ノウハウの提供が可能です

有機ELパネルやフレキシブル有機ELパネルではLTPS技術から酸化半導体TFTへ技術の転換が必須です！
酸化半導体TFTの信頼性評価にTEG評価装置を提供します
完全プログラマブル計測系を実現しました

TEG計測端子&計測機能

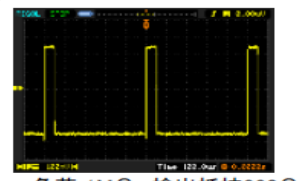
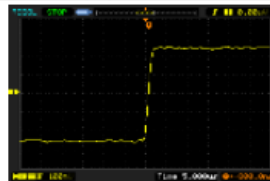
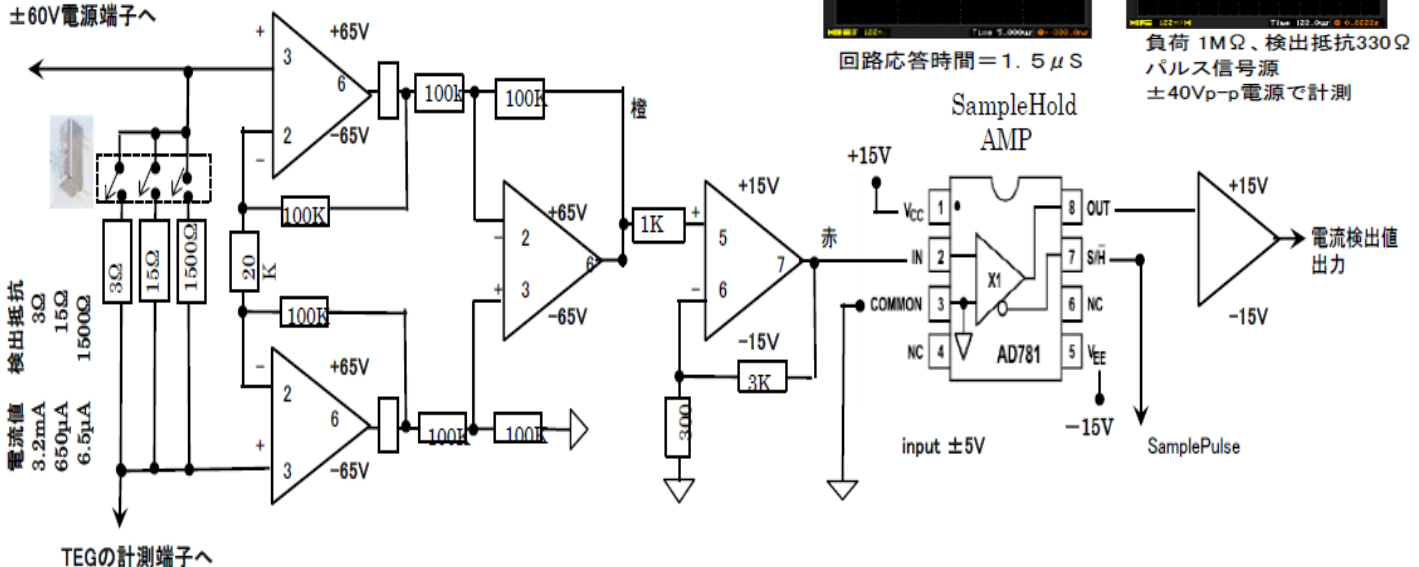
電圧印加機能(最大±60V)

・完全プログラマブル・パルス電圧設定



V0/V1/V2/V3	電圧設定	ハイサイド	nA/μA電流計測
設定最大電圧	+60.0V	測定上限電圧	+60V
設定最小電圧	-60.0V	測定下限電圧	-60V
設定分解能	0.1V	測定最大電流	2mA
立上がり時間	1 μS	測定最小電流	1 μA
立下がり時間	1 μS	測定分解能	0.5nA
最大出力電流	10mA	※サンプルホールド付き	

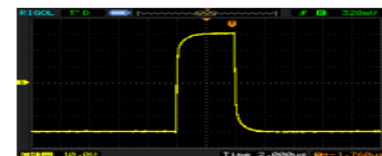
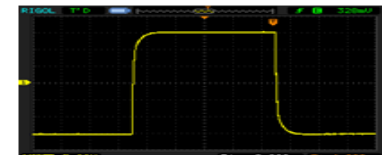
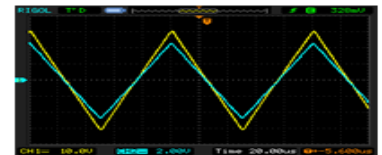
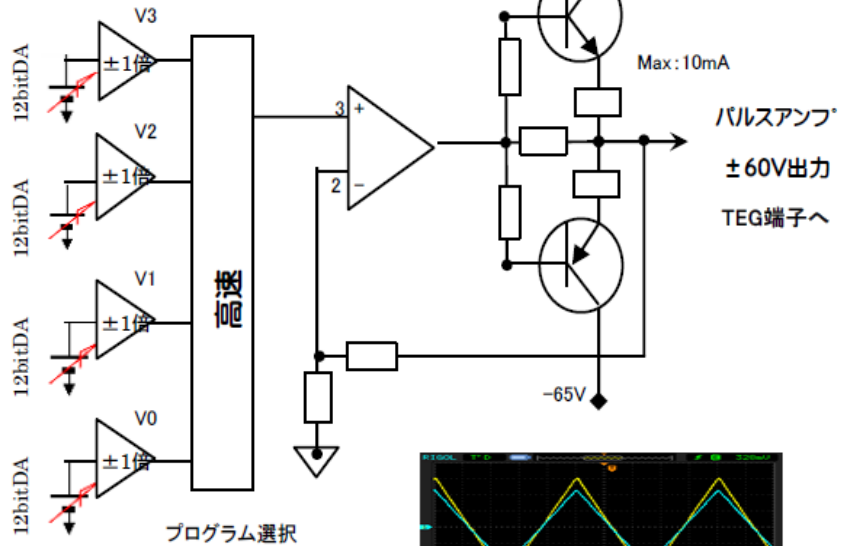
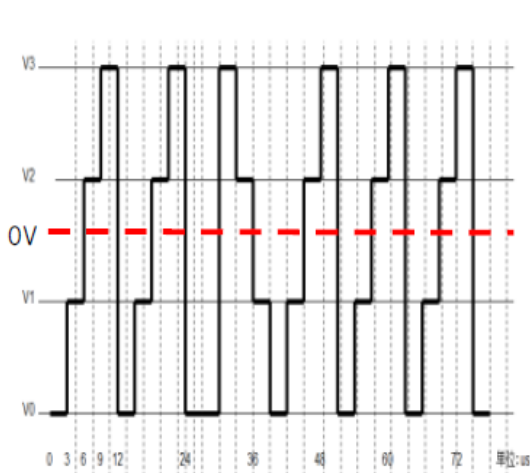
±60V電源のハイサイド電流検出回路構成



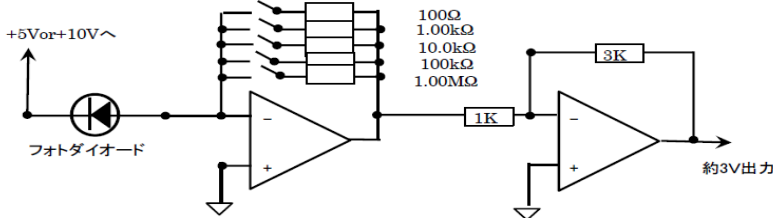
FPDバックプレーン・TFT用_TEG評価装置 最大±60V印加プログラマブル電源

酸化物半導体TFTの信頼性評価にTEG評価装置を提供します
完全プログラマブル計測系を実現しました

高速パルス電源構成

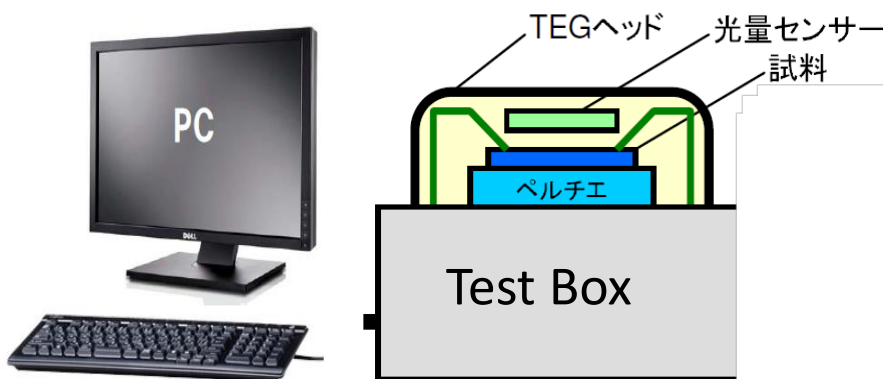


照度計回路



想定する電流検出抵抗値	電流レンジ	分解能	最大電流値	検出抵抗
H	200nA	(0.2μA)	500 ~ 10,000μA	100Ω
MH	20nA	(0.02μA)	50 ~ 1,000μA	1kΩ
MM	2nA	(0.002μA)	5 ~ 100μA	10kΩ
ML	0.2nA	(0.0002μA)	0.5 ~ 10μA	100kΩ
LL	0.02nA	(0.00002μA)	0.05 ~ 1μA	1MΩ

ユーザーはパソコン/EXCEL様APIで自由にテスト条件を設定記述



- EXCEL様に似たコマンド記述テストAPIで実行
- 完全プログラマブル実行
- 計測系15bitADC搭載
- 0.5μsタイムスライス記述
- テストステーションにヘルプ可能
- テスト結果保存
- 連続200時間実行

テストステーション構成イメージ